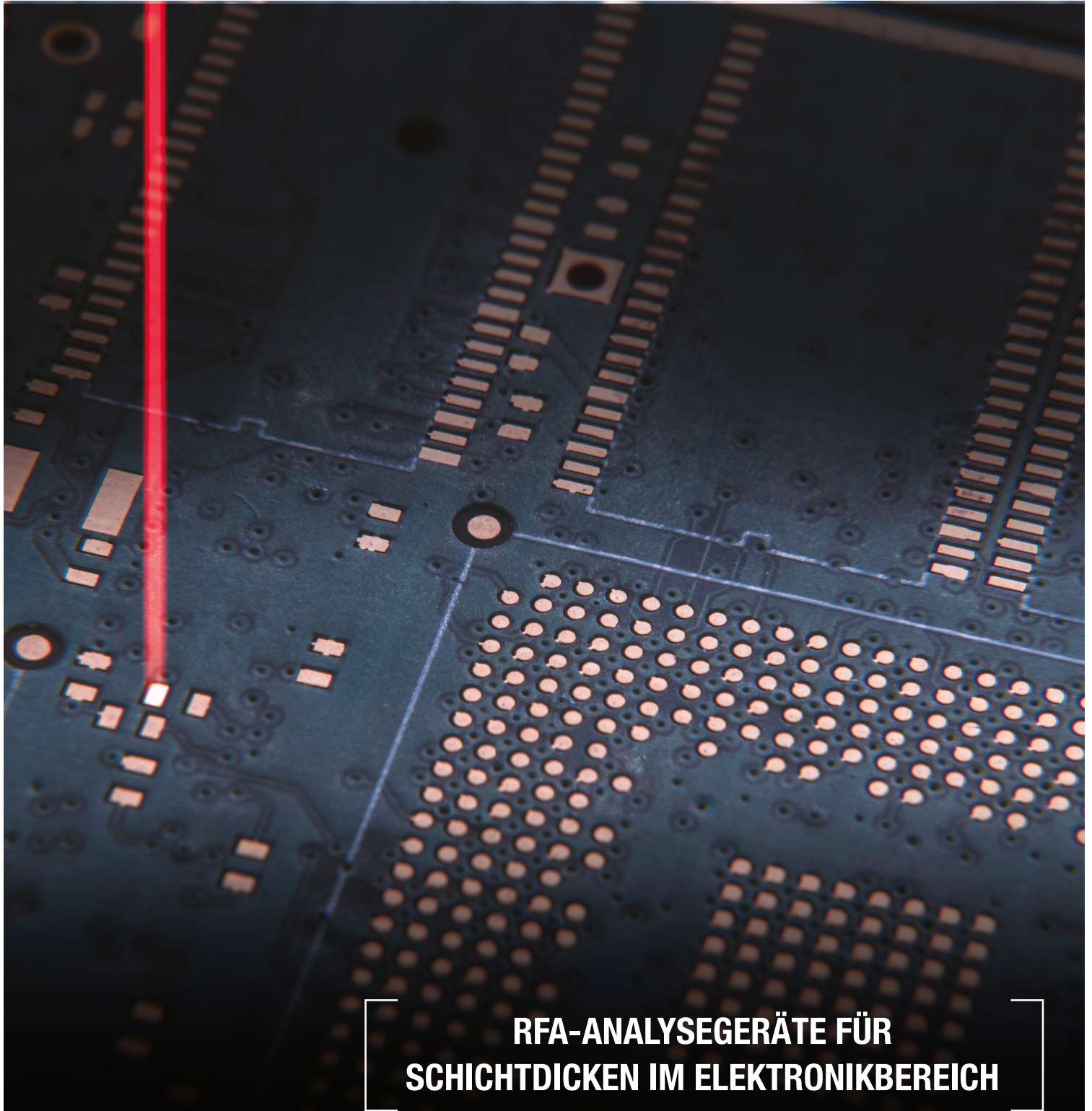


1 Nanometer kann den Unterschied machen



**RFA-ANALYSEGERÄTE FÜR
SCHICHTDICKEN IM ELEKTRONIKBEREICH**

1 Nanometer kann den Unterschied machen

Seit über 45 Jahren entwickeln wir Lösungen für die industrielle Analyse von Schichtdicken. Unsere Produkte bieten genaue und zuverlässige Messungen für jede Anforderung.

Mit unseren hochpräzisen und zuverlässigen Analysegeräten unterstützen wir Sie bei der Erfüllung von Qualitätsanforderungen industrieller Spezifikationen. Angesichts der entscheidenden Rolle der Elektronik in anspruchsvollen Märkten – Automobil, Luft- und Raumfahrt, Kommunikation und Verbraucher – sind Zuverlässigkeit und Genauigkeit in der Produktion und Qualitätskontrolle von größter Bedeutung für die Sicherheit. Unsere Auswahl an Schichtdickenmessgeräten ist ideal für die High-End-Elektronik und Halbleiter-Wafer Industrie, um Beschichtungen im Nanometerbereich auf Strukturen, die weit kleiner als 100 Mikrometer sind, zu messen.

Höchste Genauigkeit für kleinste Komponenten

Die Wahl des RFA-Analysegerätes kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ihres Geschäftes ausmachen. Sie wollen in eine effektive und zukunftssichere Technologie investieren. Unsere RFA-Serie bietet eine langfristige Lösung für die Herausforderung, konsistente und genaue Beschichtungen in der miniaturisierten Elektronik zu erzielen.

Durch die Kombination von Leistungsstärke und Zuverlässigkeit kann Hitachi High-Tech dazu beitragen, die komplexesten Betriebsabläufe zu vereinfachen. Um Ihre Produktivität zu steigern, haben wir eine ausgereifte, anwenderfreundliche Technologie entwickelt. Als weitere hochflexible Optionen bieten wir:

- | Mehrere Probenbehälter und Probentischkonfigurationen für eine einfache Handhabung von Proben verschiedener Formen und Größen.
- | Programmierbare Automation zur Entlastung des Anwenders.
- | Datenverarbeitung, einschließlich Datenexport, die in ein Qualitätsmanagementsystem oder in Kundenreports integriert werden kann.
- | Kalibrationen, über die Schichtdickenanalyse hinaus, einschließlich RoHS Überprüfung.



Perfekt für Ihr Unternehmen



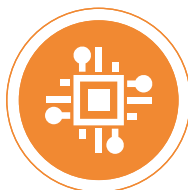
ZUKUNFTSSICHER

Fortschrittliche Technologie und die Möglichkeit, sie für neue Anwendungen zu rekonfigurieren, machen unsere Analysegeräte zu einer wirklich langfristigen Investition. So stellen Sie sicher, dass Sie immer richtig ausgestattet sind.



ZUVERLÄSSIG UND LEISTUNGSSTARK

Wenn einige Nanometer den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen können, sind Präzision und Zuverlässigkeit von zentraler Bedeutung. Unsere Lösungen bieten hohe Qualität bei gleichzeitiger Minimierung von Ausschuss und Ausfallzeiten.



FÜHRENDE TECHNOLOGIE

Unsere Produkte sind auf den Bedarf von morgen zugeschnitten, einschließlich High-End Polykapillar Optiken und fortschrittlicher Detektortechnologie zur einfachen Analyse von Schichtdicken im Nanometerbereich.



GERINGE BETRIEBSKOSTEN

Die Hitachi Produkte verursachen geringe Betriebskosten. Unsere Instrumente wurden nach höchsten Standards gebaut und sind auf maximale Betriebszeit ausgelegt, um mit der Produktion Schritt halten zu können.



ANWENDERFREUNDLICH

Unsere Analysegeräte sind leicht zu bedienen und benötigen ein minimales Anwendertraining. Intuitive Bildschirmmenüs und programmierbare, automatische Probestests sorgen mit Einfachheit und Effizienz für die Minimierung von Fehlern und Kostensenkung für Arbeitskräfte.



FORTLAUFENDE UNTERSTÜTZUNG

Unser fortlaufender Support-Service ist ein wichtiger Teil von dem was wir tun. Wir bieten Ihnen zeitkritische, erschwingliche Support-Lösungen um Verzögerungen in der Produktion und unnötige Ausfallzeiten zu vermeiden.

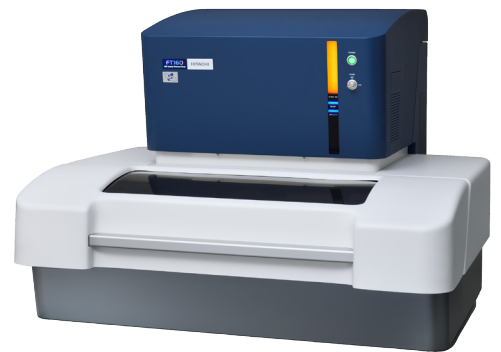


MIKROSPOT-ANALYSE FÜR MINIATURISIERTE ELEKTRONIK: FT160

Entwickelt für Mikrospot und ultradünne Schichtdickenanalyse, bewältigt dieses zukunftsichere Instrument die Herausforderung der zunehmend miniaturisierten Welt der Elektronik.

Das FT160 bietet:

- | Eine polykapillare Optik und einen hochsensiblen SDD-Detektor.
- | Messungen von Strukturen, die kleiner sind als 50 µm.
- | Hervorragende Leistung um die Herausforderungen der Halbleiter-Wafer Technologie zu meistern.
- | Schnelle Ergebnisse und Anwenderfreundlichkeit zur Steigerung der Produktivität.
- | Eine breite Tür und einen großen Tisch zur einfachen Probenpositionierung.
- | Ein großes Fenster für die Beobachtung der Probe während des Tests.

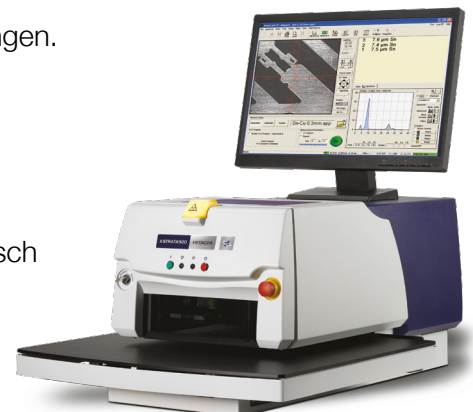


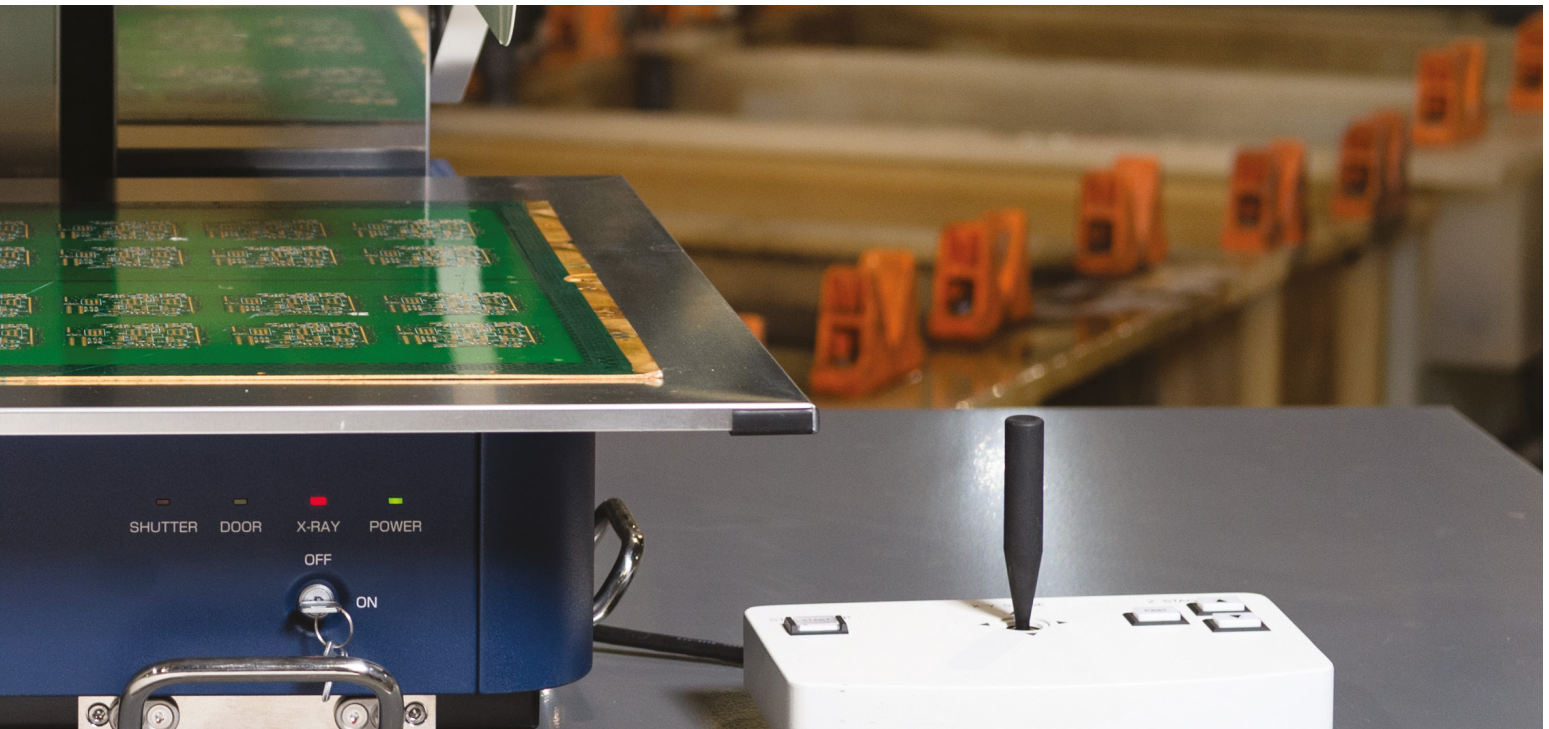
FLEXIBLE PASSFORM FÜR PROBEN JEGLICHER FORM: X-STRATA920

Der X-Strata920 wurde für die Analyse von Proben mit einer Vielzahl von Formen und Größen entwickelt und misst Hunderte von Anwendungen, darunter Leiterplattenoberflächen, Steckverbinder-Beschichtungen und vieles mehr.

Das X-Strata920 bietet:

- | Eine hochauflösende SDD-Option für die Analyse komplexer Beschichtungen.
- | Vier Konfigurationen für Proben verschiedener Formen.
- | Eine geschlitzte Kammer für schmale oder lange und dünne Proben.
- | Eine optionale Mini-well Erweiterung für größere Teile.
- | Ein optionaler motorisierter, programmierbarer Probentisch, der automatisch mehrere Proben an verschiedenen Positionen auf einer einzigen Leiterplatte misst.
- | Optimierte Kalibrierung mit zertifizierten Standards zur Gewährleistung vollständiger Genauigkeit.





LEISTUNGSSTARKE RFA FÜR GRÖßERE PROBEN: FT110A

Dieses fortschrittliche RFA-Analysegerät wurde für die Aufnahme großer Proben entwickelt, ist einfach zu bedienen und liefert schnelle und genaue Ergebnisse.

Das FT110A bietet:

- | Optionale Dualkamera für eine Weitwinkelansicht und einfache Strukturerkennung.
- | Automatisierte Probenfokussierung für erhöhten Durchsatz und Anwenderfreundlichkeit.
- | Simultanes Testen von bis zu vier Schichten, einschließlich des Substrats.
- | Minimalen Schulungsbedarf.
- | Schnelle und genaue Ergebnisse.



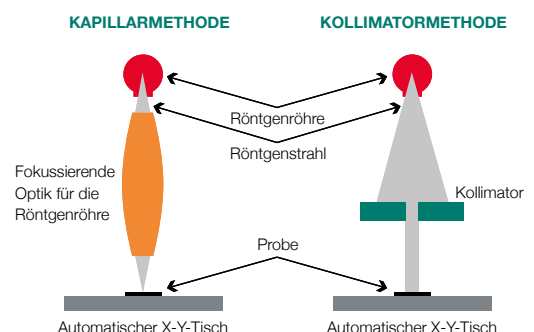
ERWEITERTE TECHNOLOGIEOPTIONEN

Polykapillare Optik:

- | Leistungsstarke Fokussieroptik, ideal zum Messen von Strukturen kleiner als 50 µm.
- | Optimierter Durchsatz für die hochpräzise Analyse von Beschichtungen im Nanometerbereich.
- | Zukunftssicheres Design für immer kleiner werdende Bauteile.

Kollimator:

- | Für ein einzelnes Instrument sind mehrere Größenooptionen verfügbar, um die beste Präzision für jede Struktur zu erzielen.
- | Runde oder rechteckige Formen, die am besten zu Ihren Proben passen.
- | Flexible Konfigurationen zum sicheren Messen von Strukturen kleiner als 50 µm of varying sizes.



Unsere Auswahl an Handmessgeräten

Diese einfachen Hand- und Tischmessgeräte verwenden Wirbelstrom- oder Mikrowiderstandstechnologie, um Schichtdicken auf Kontakten zu messen. Sie sind ideal, um Kupfer auf Leiterplatten oder Durchkontaktierungen zu messen.



CMI760 SERIE

Misst Oberflächenkupfer und Durchgangsbohrungskupfer in einer Einheit.

Hauptmerkmale:

- | Duale Technologie – Wirbelstrom und Mikrowiderstand.
- | Oberflächen- und Durchgangsbohrungsproben.
- | Aktive statistische Anzeige.
- | Optionaler Fußschalter.



CMI511 SERIE

Misst Durchgangsbohrungskupfer mit Temperaturkompensation.

Hauptmerkmale:

- | Mit der Temperaturkompensation bekommen Sie Genauigkeit direkt aus dem Bad.
- | Misst vor oder nach dem Ätzen.
- | Werkskalibrationen.



CMI165 SERIE

Zur temperaturkompensierten Messung der Oberfläche und der Kupferdicke.

Hauptmerkmale:

- | Langlebiges Design.
- | Proprietäre SRP-T1 austauschbare Sondenspitze.
- | Lichtpendende Sondenspitze für einfache Positionierung.

Unser Service

Hitachi High-Tech's globales Netzwerk von Service Zentren bietet ein großes Angebot an technischer Unterstützung um Ihnen einen störungsfreien Arbeitsbetrieb zu ermöglichen:



TELEFONISCHER HELPDESK

Wann immer Sie ein Problem haben, wir helfen gern.



ONLINE DIAGNOSTIK

Umfassende und schnelle Unterstützung über unsere Webseite.



TRAINING

Wir unterstützen Sie dabei, das Beste aus Ihrem Analysegerät herauszuholen und alle Funktionen zu nutzen.



GARANTIEERWEITERUNGEN

Um Ihnen zusätzliche Sicherheit zu geben und ungeplante Kosten zu vermeiden.



REPARATURSERVICE

Vermeiden Sie ungeplante Kosten mit unseren Servicevereinbarungen. Wir bieten Ihnen einen schnellen und effizienten Reparaturservice, Rezertifizierung und Wartung um sicherzustellen, dass Ihr Analysegerät in exzellentem Zustand ist.



Grundlegende Sicherheitstrainings für die Verwendung von röntgenbasierten Geräten können in Ihrem Land oder Ihrer Region erforderlich sein.

Was kommt als nächstes?

Sehen Sie das FT160 in Aktion

Laden Sie die unsere Visualisierungs-App herunter, um mit Ihrem Telefon oder Tablet das FT160 in Aktion zu sehen und die Vorteile für Ihr Unternehmen zu erfahren



Kontaktieren Sie noch heute einen unserer Experten unter **contact@hitachi-hightech.com**, um eine Produktvorführung zu vereinbaren.

WEITERE INFORMATIONEN

Weitere Informationen zum FT160 finden Sie unter **hhtas.net/elektronik**



Weitere Anwendungen

RoHS-Screening - Speziallösungen für RoHS-Verunreinigungen, einschließlich Phthalate.

- RFA für RoHS, Beschichtungen und Element-Mapping.
- Phthalat-Screening durch thermische Desorption.

Thermische Analyse - Analyse empfindlicher Materialien einschließlich thermischer Beständigkeit.

- DSC, TGA und kombinierte und STA-Analyse.
- Optionale Real View-Technologie zum Betrachten des Materialverhaltens auf dem Bildschirm.

Hitachi High-Tech Analytical Science

Diese Publikation ist das urheberrechtlich geschützte Eigentum von Hitachi High-Tech Analytical Science und bietet nur eine Übersicht, die (sofern nicht schriftlich vom Unternehmen genehmigt) für keine Zwecke verwendet, übertragen oder vervielfältigt werden darf und die weder Bestandteil eines Auftrags oder Vertrags ist noch als Zusicherung in Bezug auf die betroffenen Produkte oder Dienstleistungen gilt. Hitachi High-Tech Analytical Science verfolgt die Richtlinie der ständigen Verbesserung. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Spezifikation, das Design oder die Lieferbedingungen eines Produkts oder einer Dienstleistung ohne Vorankündigung zu ändern.

Hitachi High-Tech Analytical Science erkennt alle Handelsmarken und Zulassungen an.

© Hitachi High-Tech Analytical Science, 2020.
Alle Rechte vorbehalten.

Artikelnummer: 10017352



Science for
a better tomorrow

